

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

по теме: «Развитие методов диагностики материалов и элементной базы – 2»

Чт. 9 декабря 2021 г., здание РАН (г. Москва, Ленинский пр-т, 32А, Синий зал)

- 10:00- академик РАН Красников Геннадий Яковлевич (АО «НИИМЭ»). Открытие заседания.
10:10
10:10- (1) профессор РАН, д.ф.-м.н. Моргунов Роман Борисович (ИПХФ РАН). Оптимизация
10:35 частотного диапазона магнитной релаксации при диагностике одно-ионных и
одномолекулярных магнитов в ферромагнитном композите.
10:35- (2) онлайн к.ф.-м.н. Бабунц Роман Андреевич, д.ф.-м.н. Баранов Павел Георгиевич
11:00 (ФТИ им. А.Ф. Иоффе). Диагностический комплекс на основе линейки
высокочастотных спектрометров ЭПР/ОДМР.
11:00- (3) д.т.н. Быков Виктор Александрович (ООО «НТ-МДТ С.И.»). Современные
11:25 возможности сканирующей зондовой микроскопии и спектроскопии высокого
разрешения для диагностики материалов и элементной базы Нанoeлектроники -
возможности проведения разработок и производства в России.
11:25- (4) д.ф.-м.н. Светухин Вячеслав Викторович (НПК «Технологический центр»
11:50 Функциональный контроль и диагностика магниторезистивных наноструктур и
элементов МЭМС в процессе разработки и производства новой компонентной базы.
11:50- (5) онлайн профессор РАН, д.ф.-м.н. Кузнецова Ирен Евгеньевна (ИРЭ им.
12:15 В.А. Котельникова РАН), д.ф.-м.н. Зайцев Борис Давыдович, к.ф.-м.н. Теплых Андрей
Алексеевич (СФ ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН). Определение акустических и
электрических свойств пленок из новых материалов при помощи пьезоэлектрических
резонаторов различного типа.
12:15- (6) онлайн к.ф.-м.н. Юнин Павел Андреевич, к.ф.-м.н. Дроздов Михаил Николаевич,
12:40 к.ф.-м.н. Новиков Алексей Витальевич (ИФМ РАН - филиал ИПФ РАН). Новые
подходы по использованию ВИМС и рентгеновского дифракционного анализа для
исследования материалов электроники.
12:40- (7) онлайн д.т.н. Крылов Владимир Павлович, д.т.н. Татмышевский Константин
13:05 Вадимович, Богачев Алексей Михайлович (ВлГУ). Емкостная релаксационная
спектроскопия глубоких уровней в задачах контроля полупроводниковых структур,
приборов и интегральных микросхем.
13:05- (8) к.ф.-м.н. Иржак Дмитрий Вадимович, к.ф.-м.н. Иржак Артемий Вадимович,
13:30 Пундииков Кирилл Сергеевич (ИПТМ РАН). Применение метода главных компонент
для анализа экспериментальных спектров комбинационного рассеяния света при
исследовании материалов акустоэлектроники.
13:30- (9) онлайн д.ф.-м.н. Ходос Игорь Иванович, к.ф.-м.н. Матвеев Виктор Николаевич
13:55 (ИПТМ РАН). Электронная микроскопия графеноподобных структур, получаемых
каталитическим синтезом, и их физические свойства.
13:55- (10) онлайн к.т.н. Мазилкин Андрей Александрович (ИФТТ РАН). Методы
14:20 просвечивающей электронной микроскопии в материаловедении.
14:20- (11) онлайн к.ф.-м.н. Кузьмин Алексей Васильевич (ИФТТ РАН). Структурная
14:45 характеристика функциональных органических кристаллов.
14:45- (12) д.ф.-м.н. Чуев Михаил Александрович (ФТИАН им. К.А. Валиева РАН). Тема
15:10 уточняется.
15:10- Общая дискуссия. Подведение итогов заседания.
15:20

В пронумерованных пунктах включены 5 минут для ответов на вопросы.

Кофе-брейк организован в фойе с 09:30 до 14:00, посещение в свободном порядке.